

項目		規格 (松崎電気製作所) (JIS C 6439 -1995)	試験方法 (JIS C 5102)
使用温度範囲		記号 使用温度範囲 X -55 ~ +125°C Y -55 ~ +85°C Z -25 ~ +85°C	
耐電圧	端子間	異常がないこと。	(JIS C 5102-7.1 による) 試験電圧は定格電圧の200%とする 印可時間は2~5秒間とする 充放電の制限電流は50mA MAX
	端子間とケース 又は外装間		
絶縁抵抗	端子間	図1に示す値以上	(JIS C 5102-7.6 による) 測定電圧は定格電圧が500V以下のものは100V 500Vを超えるものは500Vとする
	端子間とケース 又は外装間		
静電容量		規定の許容差以内	(JIS C 5102-7.8 による) 測定電圧は5Vrms以下 測定周波数 1000PFのものは1MHz 1000PFを超えるものは1KHz
誘電正接 (tan δ)		図2に示す値以下	
静電容量の温度係数 (ppmv / °C) 及び静電容量のずれ		特性 温度係数 静電容量のずれ B 規定しない 規定しない C -200~200 ±(0.5%+0.1PF) 以内 D -100~100 ±(0.3%+0.1PF) 以内 E -20~100 ±(0.1%+0.1PF) 以内 F 0 ~ 70 ±(0.05%+0.1PF) 以内	(JIS C 5102-7.12 による)
耐熱性	外観	著しく異常がないこと	(JIS C 5102-9.2 による) 試験温度は最高使用温度±2°Cとする 試験時間は16±1時間とする
	絶縁抵抗(端子間)	図3に示す値以上	
	静電容量変化量	試験前の値の±5% 又は ±1PFmのうちいずれか大きい方の値	
温度及び 浸漬サイクル	外観	著しく異常がないこと	(JIS C 5102-9.18 による) 清水の温度 65°C
	耐電圧(端子間)	図4に示す値以上	
	絶縁抵抗(端子間)	番号5の規定値の150% 以下	
	静電容量変化量	試験前の値の±3% 又は ±1PFのうちいずれか大きい方の値	
耐湿性 (定常状態)	外観	著しく異常がないこと	(JIS C 5102-9.5 による) 試験温度: 40±2°C 相対湿度: 90~95% 試験時間: 240時間 ± 8時間
	耐電圧(端子間)	番号2を満足すること	
	絶縁抵抗(端子間)	図4に示す値以上	
	誘電正接	番号5の規定値の120% 以下	
	静電容量変化量	試験前の値の±3% 又は ±1PFのうちいずれか大きい方の値	

図1 静電容量と絶縁抵抗の関係

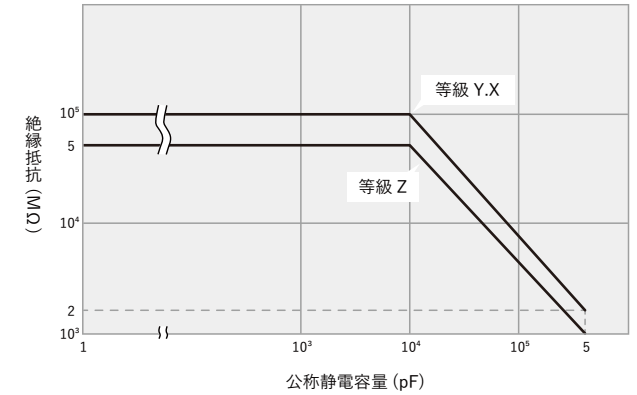


図2 公称静電容量と誘電正接の関係

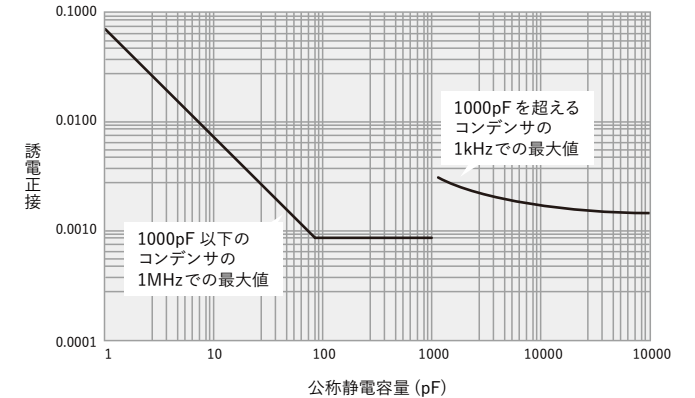
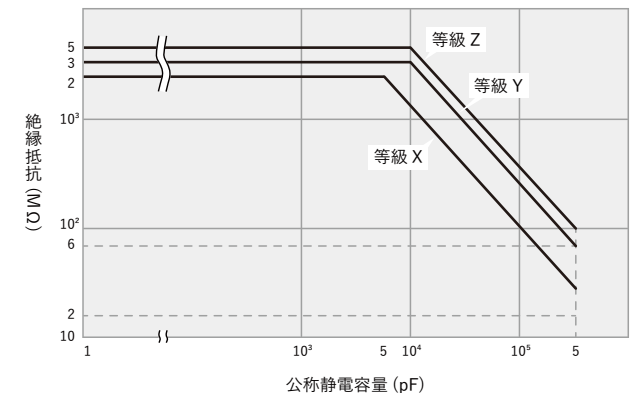


図3 静電容量と絶縁抵抗の関係



項目	規格 (松崎電気製作所) (JIS C 6439 -1995)	試験方法 (JIS C 5102)
耐湿性 (定常状態)	外観	著しく異常がないこと
	耐電圧(端子間)	番号2を満足すること
	絶縁抵抗(端子間)	図4に示す値以上
	誘電正接	番号5の規定値の120%以下
	静電容量変化量	試験前の値の±3%又は ±1PFのうちいずれか大きい方の値
耐湿性 (温湿度サイクル)	耐電圧(端子間)	著しく異常がないこと
	外観	番号2を満足すること
	絶縁抵抗(端子間)	図4に示す値以上
	誘電正接	番号5の規定値の150%以下
	静電容量変化量	試験前の値の±3%又は ±1PFのうちいずれか大きい方の値
耐湿負荷	外観	著しく異常がないこと
	耐電圧(端子間)	番号2を満足すること
	絶縁抵抗(端子間)	図4に示す値以上
	誘電正接	番号5の規定値の200%以下
	静電容量変化量	試験前の値に対し下記の値 又は ±1PF いずれか大きい方の値
耐湿負荷	外観	著しく異常がないこと
	耐電圧(端子間)	番号2を満足すること
	絶縁抵抗(端子間)	図4に示す値以上
	誘電正接	番号5の規定値の200%以下
	静電容量変化量	試験前の値に対し下記の値 又は ±1PF いずれか大きい方の値 特性 C: 変化率 ±3% 特性 D,E,F: 変化率 ±5%
はんだ付け性	浸漬したところまで表面の周囲方向の95% 以上が新しいはんだで覆われていること	(JIS C 5102-8.4による) 試験方法: 方法1
はんだ耐熱性	外観	著しく異常がないこと
	耐電圧(端子間)	番号2を満足すること
	絶縁抵抗(端子間)	図4に示す値以上
	誘電正接	番号5の規定値の150%以下
	静電容量変化量	試験前の値の ±0.5% 又は ±5F のうち いずれか大きい方の値

図4 静電容量と絶縁抵抗の関係

